(東工大院・理<sup>1</sup>,東工大・科学技術創成院<sup>2</sup>)
○藤井 慎太郎<sup>1</sup>,小池 将人<sup>1</sup>,木口 学<sup>1</sup>,庄子 良晃<sup>2</sup>,福島 孝典<sup>2</sup>

## Structural changes in a molecular layer of a mechanochromic

## molecule on Au(111)

(<sup>1</sup>Dept. of Chem., Tokyo Inst. of Tech.,
<sup>2</sup>Lab. for Chem. and Life Sci., Tokyo Inst. of Tech.)
OShintaro Fujii<sup>1</sup>, Masato Koike<sup>1</sup>, Manabu Kiguchi<sup>1</sup>, Yoshiaki Shoji<sup>2</sup>,
Takanori Fukushima<sup>2</sup>

【序】物性のスイッチ研究は、積極的な物性制御の観点からの基本的かつ必須な研究 である。近年、プローブ顕微鏡を用いて単分子レベルでの分子内構造スイッチ機能が 提案、実証されている。本研究では、分子内構造スイッチに応じて、その電気伝導特 性が変化する電気スイッチの開発を目的とした。この目的のために、構造変化により クロミズム(光学特性変化・電子状態変化)を示す overcrowded ethylene 分子(図. 1, 文献[1])を用いた。走査型トンネル顕微鏡(STM)により、金属表面上に吸着し たクロミック分子に局所摂動を加え、配座異性化させることで、伝導度スイッチの誘 起を行った。

【実験】マイカ上に金を真空蒸着し、約 350℃で 2 時間アニーリングすることで Au (111) 基板を作製した。この基板をクロミック分子(図 1)を含むジクロロメタン 溶液に 12 時間以上浸漬させることで分子膜を作製した。STM 観察は大気中、室温で タングステン探針を用いて行った。また、すべての STM 観察は正サンプル電圧条件 で行った。



図1 (a) メカノクロミック分子 (overcrowded ethylene) の化学構造式 (b) メカ ノクロミック分子の2つの配座異性体: folded 型、twisted 型。Folded 型と比較 して、twisted 型は小さな HOMO-LUMO ギャップを示す。

【結果】STM 観察の結果、クロミック分子は folded 型で吸着した膜構造を示すこと が分かった。Folded 型の膜構造について高分解能観察を行ったところ、分子は Au(111)表面上に規則的な吸着構造を形成していることが分かった(図 2a)。理論計 算により得られた、分子内の電荷分布を図 2b に示す。硫黄原子と窒素原子がそれぞ れ正と負に帯電している。このため、folded 型の分子は分子間静電的相互作用により 二次元ネットワークを形成していることが分かった(図 2b)。次に、サンプル加熱が 分子膜構造へ与える影響を調査した(図 2c)。約100℃で1時間以上の加熱を行うこ とで、規則構造が失われることが分かった。加熱後することで、分子内配座が folded 型から twisted 型へ変化し、分子間相互作用が失われたためであると考えられる。 最後に、folded 型で吸着した分子膜について、STM による分子スイッチの誘起を検 討した(図 2d)。図 2d の白い四角で示した領域において、負電圧印加条件(サンプ ル電圧=-1.0 V) でスキャンした結果、スキャンした領域の分子が folded 型から twisted 型へ変化した。Folded 型と twisted 型の分子の伝導度(STM height)を比 較するために、図 2e に folded 型と twisted 型分子膜の境界領域の STM 像を示す。 Folded 型と比較して twisted 型は高い伝導度(STM height)を示すことが分かる。 以上、STM 探針を用いて、クロミック分子の電気スイッチに成功した。



図2 (a) Folded 型分子膜の STM 像 (b) Folded 型分子の電荷分布と分子 膜の構造モデル (c) 加熱後の twisted 型分子膜の STM 像 (d) STM 誘起によ る分子スイッチ現象前後の STM 像、上図の白い四角で示した領域を負バイア ス印加条件でスキャンした。(e) Folded 型と twisted 型分子膜の境界領域の STM 像

【参考文献】

[1] T. Suzuki, T. Fukushima, T. Miyashi, and T. Tsuji, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 1997, 36, 2495-2497.